КРИСТАЛЛОГРАФИЯ, 2023, том 68, № 2, с. 306–312

= НАНОМАТЕРИАЛЫ, ₌ керамика =

УДК 546.161; 548.55; 54-165; 544.6.018.47-039.6; 620.3

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ CaF₂-BaF₂

© 2023 г. И. И. Бучинская^{1,*}, Т. О. Теплякова¹, Н. И. Сорокин¹, Д. Н. Каримов¹

¹Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова, ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, Россия

* E-mail: buchinskayaii@gmail.com Поступила в редакцию 21.11.2022 г. После доработки 21.11.2022 г. Принята к публикации 01.12.2022 г.

Композиционные наноматериалы составов $(1 - x)CaF_2 - xBaF_2$ с $0.4 \le x \le 0.6$ получены методом направленной кристаллизации расплава во фторирующей атмосфере. Изучены структурные, оптические, механические и электрофизические характеристики полученных нанокомпозитов. Двухфазные композиты $(1 - x)CaF_2 - xBaF_2$ имеют тонкую ламеллярную микроструктуру. Толщина ламелей уменьшается с увеличением содержания BaF₂ и достигает величины 30–50 нм для состава с x = 0.5. Композиты сохраняют высокую прозрачность в ИК-диапазоне, близкую к уровню исходных компонентов. Величины микротвердости ($H_V \sim 5.0$ ГПа) и ионной проводимости ($\sigma_{dc} = (1-3) \times 10^{-3}$ См/см при 823 К) таких композитов существенно превышают соответствующие характеристики кристаллов CaF₂ и BaF₂. Изученные фторидные нанокомпозиты являются перспективными материалами для практического применения в фотонике и ионике твердого тела.

DOI: 10.31857/S0023476123020054, EDN: BPZTRK

введение

Функциональные материалы на основе дифторидов металлов MF_2 (M = Ca, Sr, Ba, Pb, Cd) со структурой флюорита в виде кристаллов, керамики и пленок находят широкое применение в различных областях науки и приборостроения, особенно в фотонике и электрохимии [1-3]. В большинстве бинарных систем $M'F_2 - M''F_2$ образуются области непрерывных твердых растворов: CaF_2-SrF_2 [4], CaF_2-CdF_2 [5], CdF_2-SrF_2 [5], SrF₂-BaF₂ [6], PbF₂-SrF₂, PbF₂-BaF₂ [7] и PbF₂- CdF_{2} [7, 8]. В отличие от этих систем в системе СаF₂-ВаF₂ изоморфизм компонентов сильно ограничен из-за большого различия в параметрах кубической решетки (a = 5.463 и 6.200 Å для CaF₂ и BaF₂ соответственно) [9]. По данным фазовой диаграммы CaF₂-BaF₂ в системе существует перитектическое равновесие, предельные концентрации твердых растворов при температуре перитектики составляют 62 \pm 5 мол. % ВаF₂ в матрице CaF_2 и 8 ± 2 мол. % CaF_2 в матрице BaF_2. При этом закалить однофазные образцы удается только в узких концентрационных диапазонах. Получение оптического составов кристаллов качества $Ca_{1-x}Ba_xF_2$ (0 ≤ x ≤ 0.02) и $Ba_{1-y}Ca_yF_2$ (y = 1 - x, $0 \le y \le 0.06$) описано в [10, 11], $Ca_{1-x}Ba_xF_2$ (0.001 \le ≤ *x* ≤ 0.05) и Ва_{1-*v*}Са_{*v*}F₂ (0 ≤ *y* ≤ 0.06) − в [12]. При других концентрациях компонентов наблюдается

распад твердого раствора в виде помутнения в объеме кристалла.

Кроме монокристаллов на основе системы CaF_2-BaF_2 были получены пленки, нанопорошки и керамические композиты, которые являются перспективными материалами фотоники (оптические покрытия) и ионики твердого тела (твердые электролиты) [13–22].

Наноматериалы $(1 - x)CaF_2 - xBaF_2$ представляют особый интерес как фторпроводящие твердые электролиты. Наноразмерный эффект в ионной проводимости был уже найден для индивидуальных дифторидов [23–25]. Гетерослои .../CaF₂/BaF₂/CaF₂/... [13–17], осажденные методом молекулярно-лучевой эпитаксии, проявляют повышенную двумерную ионную проводимость вдоль слоев.

Путем механосинтеза (**MC**) удалось получить непрерывный флюоритовый твердый раствор во всем диапазоне концентраций компонентов и исследовать в нем ионную подвижность и механизм ионного переноса [18–21, 25]. Однако непрерывный твердый раствор $Ca_{1-x}Ba_xF_2$ оказался неравновесным и претерпевал при 723 К превращение в смесь двух фаз с параметрами решетки, близкими к чистым CaF_2 и BaF_2 [21].

В [22] исследована электропроводность нанокомпозиционного образца состава 0.7CaF_2 — 0.3BaF_2 , полученного методом спонтанной кристаллизации из расплава. Обнаружено повышение проводимости композита по сравнению с исходными компонентами. Но в [22] не исследовали концентрационную зависимость проводимости композитов $(1 - x)CaF_2 - xBaF_2$.

Целью настоящей работы является получение объемных наноструктурированных композиционных материалов в системе CaF₂–BaF₂ из расплава методом вертикальной направленной кристаллизации и исследование их функциональных характеристик.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Направленная кристаллизация расплава составов 0.4CaF₂–0.6BaF₂, 0.5CaF₂–0.5BaF₂ и 0.6CaF₂–0.4BaF₂ осуществлялась методом Бриджмена в графитовом тепловом узле в многоячеистом графитовом тигле. В качестве исходных реактивов использовали бой оптических кристаллов CaF₂ марки Φ K-У и BaF₂ марки Φ Б-И. В качестве фторирующего агента использовали CF₄. Расплав компонентов выдерживали при 1600 К для гомогенизации в течение 3 ч. Температурный градиент в ростовой зоне составлял 80 К/см, скорость вывода тигля из горячей зоны – 5 мм/ч. Скорость охлаждения композитов составляла 100 К/ч. Потери на испарение не превышали 0.5 мас. %.

Образцы для исследований толщиной h = 1 - 10 мм вырезали из центральных участков слитков и полировали.

Рентгенофазовый анализ выполняли на порошковом рентгеновском дифрактометре Rigaku MiniFlex 600 (излучение CuK_{α}). Дифрактограммы регистрировали в диапазоне углов 20 от 20° до 100°. Расчет параметров элементарной ячейки в рамках пр. гр. $Fm\overline{3}m$ проводили методом полнопрофильного анализа Le Bail с использованием программы Jana2006.

Сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) для изучения морфологических особенностей микроструктуры композитов проводили с помощью растрового электронного микроскопа Scios (FEI Company) с использованием детектора обратно рассеянных электронов в режиме Optiplan.

Спектры пропускания полученных нанокомпозитов регистрировали при комнатной температуре с помощью спектрофотометра Cary 5000 (Agilent Technologies) и ИК-фурье-спектрометра Nicolet Nexus 5700 (Thermo Scientific) в диапазоне длин волн $\lambda = 0.2-16$ мкм.

Показатель преломления n_D ($\lambda = 0.589$ мкм) измеряли при комнатной температуре при помощи рефрактометра ИРФ-454.

Твердость образцов H_V исследовали при комнатной температуре методом микроиндентирования на твердомере Duroline-MH-6 (Metkon Instruments) по методу Виккерса. Значения микротвердости H_V [кгс/мм²] рассчитывали по формуле

$$H_V = 1.8544 P/d^2,$$
 (1)

где $P[\Gamma]$ — нагрузка на индентор, d[MM] — диаметр диагонали отпечатка индентора. Измерения проводили при P = 50 г (25 г для образца 0.6CaF_2 — 0.4BaF_2) и времени выдержки индентора 10 с. Погрешность измерения H_V не превышала 6%.

Ионную проводимость σ_{dc} бинарных композитов (1 - x)CaF₂-xBaF₂ измеряли методом импедансной спектроскопии на приборе Tesla BM-507 на частотах 5 Гц-500 кГц в вакууме ~1 Па в интервале температур 636-831 К. Описание методики импедансных измерений приведено в [26]. Для кондуктометрических измерений использовали образцы в виде монолитных таблеток толщиной до 2 мм. В качестве электродов, наносимых на торцы таблеток в виде кругов 4 и 6 мм, использовали графитовую пасту DAG-580. Наличие блокирующего эффекта от графитовых электродов указывает на преимущественный ионный характер электропроводности.

Величину электропроводности σ_{dc} на постоянном токе рассчитывали по формуле

$$\sigma_{dc} = h/(R_b S), \tag{2}$$

где R_b — объемное сопротивление, h — толщина образца, S — площадь электрода. Погрешность определения σ_{dc} равна 5%.

Параметры ионной проводимости определяли из уравнения Аррениуса–Френкеля

$$\sigma_{dc}T = A \exp(-E_a/kT), \qquad (3)$$

где *А* — предэкспоненциальный множитель и *E*_a — энергия активации электропроводности.

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ КОМПОЗИТОВ $(1 - x)CaF_2 - xBaF_2$

Полученные из расплава композиты (1 - x)Са $F_2 - x$ Ва F_2 имели разную степень прозрачности и сохраняли монолитность. Их внешний вид, определяемый твердофазным распадом в системе Ca F_2 -Ba F_2 при охлаждении, в сравнении с чистыми кристаллическими компонентами показан на рис. 1. Прозрачность материала визуально увеличивается с увеличением доли *x*.

Рентгенофазовый анализ выявил во всех композитных образцах присутствие двух флюоритовых фаз (пр. гр. $Fm\overline{3}m$) одинакового состава в разном количественном соотношении (табл. 1). В качестве примера на рис. 2 приведена дифрактограмма композита для x = 0.5. Если считать, что для системы CaF₂-BaF₂ справедливо правило Вегарда, можно оценить составы предельных твердых растворов как Ca_{0.985}Ba_{0.015}F₂ и Ca_{0.050}Ba_{0.950}F₂ с точностью до $\Delta x = \pm 0.005$. На рис. За показана количественная оценка фазового состава трех образцов, проведенная с помощью метода эталонного отношения интенсивностей (**RIR**). На рис. Зб приведены параметры флюоритовых твердых растворов, как близких к равновесным, так и неравновесных, полученных методом MC [20, 27].

На рис. 4 показаны результаты СЭМ-исследования полученных нанокомпозитов. Все образцы имеют ламеллярную структуру, образовавшуюся в результате твердофазного распада. Толщина ламелей уменьшается с увеличением содержания ВаF₂ и составляет несколько десятков нанометров для образца 0.4CaF2-0.6BaF2 (рис. 4). Аналогичная микроструктура с толщиной ламелей менее 100 нм была обнаружена у сплава 0.7CaF₂-0.3BaF₂ [22]. В образце 0.6CaF₂-0.4BaF₂ наряду с колониями ламелей встречаются крупные (до 4 мкм) ограненные включения фазы, обогащенной кальцием. Зародыши этой фазы выпадают первоначально при перитектической кристаллизации твердого раствора данного состава. При понижении температуры на ламели распадается другая фаза, обогащенная барием. В процессе охлаждения зерна "кальциевой" фазы могут дополнительно разрастаться и приобретать огранку.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ (1 – *x*)CaF₂–*x*BaF₂

Спектры пропускания. Коротковолновый край пропускания композитов существенно сдвинут в длинноволновую часть спектра по сравнению с чистыми компонентами, глубоко прозрачными в УФ-диапазоне (рис. 5). Прослеживается обратная корреляционная зависимость между характерным размером распадных микроструктур (содержанием BaF_2 в композите) и положением коротковолновой границы пропускания. Для наиболее прозрачного образца 0.4CaF₂-0.6BaF₂ (вставка на рис. 5а) эта граница составляет 0.35 мкм, а для самого визуально непрозрачного образца 0.6CaF₂-



Рис. 1. Диаграмма состояния системы CaF₂–BaF₂ [9] и внешний вид материалов соответствующих составов.

0.4Ва F_2 она сдвигается в длинноволновую область спектра вплоть до 1 мкм. Изученные композиты сохраняют прозрачность в ИК-области, характерную для кристаллов исходных компонентов (рис. 5а). Граница ИК-пропускания композитов занимает промежуточное положение между однокомпонентными фторидами и монотонно сдвигается в область больших длин волн с ростом содержания Ва F_2 в составе образцов (вставка на рис. 5б). Отметим присутствие характерных для кристаллов Ва F_2 марки ФБ-И полос поглощения ионов Pb²⁺, связанных с использованием Pb F_2 в качестве раскислителя при их промышленном выращивании (кривая 2, рис. 5а).

Материалы	$a, \text{\AA}$ Ca _{1-x} Ba _x F ₂	$a, \text{\AA}$ Ba _{1-y} Ca _y F ₂	$\begin{array}{c} \operatorname{Ca}_{1-x}\operatorname{Ba}_{x}\operatorname{F}_{2}/\operatorname{Ba}_{1-y}\\ \operatorname{Ca}_{y}\operatorname{F}_{2}\left(\operatorname{RIR}\right) \end{array}$	$H_V(P=50 \mathrm{r}),$ ГПа	Эффективный показатель преломления n _D	σ _{<i>dc</i>} , См/см <i>T</i> = 823 К
BaF ₂		6.200		0.75	1.4714	4×10^{-4} [22]
$0.4 CaF_2 - 0.6 BaF_2$	5.4710(5)	6.1652(4)	36.5/63.5	1.79	1.4627	1.3×10^{-3}
$0.5 CaF_2 - 0.5 BaF_2$	5.4677(8)	6.1670(4)	46.3/53.7	1.97	1.4588	2.5×10^{-3}
$0.6 CaF_2 - 0.4 BaF_2$	5.4742(5)	6.1558(4)	51.5/48.5	2.04	1.4546	2.4×10^{-3}
0.7CaF ₂ -0.3BaF ₂ [22]	5.473	6.170				8.6×10^{-3}
CaF ₂	5.463			1.76 [32]	1.4354	3×10^{-5} [22]

Таблица 1. Некоторые физические параметры исследованных материалов



Рис. 2. Дифрактограмма композита с x = 0.5. Показаны положения рефлексов Брэгга для пр. гр. $Fm\overline{3}m$ с параметрами a = 5.4677(8) и 6.1670(4) Å.

Ионная проводимость. На рис. 6 показаны температурные зависимости ионной проводимости композиционных материалов, синтезированных из расплава методом направленной кристаллизации; параметры уравнения Аррениуса–Френкеля приведены в табл. 2. Для изученных составов (1 – -x)CaF₂–xBaF₂ при 636–738 К энергии активации практически совпадают (0.75–0.78 эВ), значения ионной проводимости различаются в 2 раза (1.3 × 10⁻³–2.5 × 10⁻³ См/см при 823 К). Для композита с x = 0.4 (кривая *I*, рис. 6) на температурной зависимости $\sigma_{dc}(T)$ при высоких температурах (737–824 К) наблюдается второй участок с энергией активации $E_a = 1.09$ эВ. Этот факт указывает на наличие двух механизмов электропроводности в композиционном материале 0.6CaF_2 — 0.4BaF_2 . Возможной причиной появления дополнительно высокотемпературного механизма электропроводности является наличие наряду с колониями ламелей крупных включений твердого раствора на основе CaF₂ (рис. 4 для x = 0.4).

Для сравнения методик направленной и спонтанной кристаллизаций измерена ионная проводимость композита 0.5CaF₂-0.5BaF₂, синтезированного из расплава путем его быстрого охлаждения (табл. 2). Композиционный матери-

Материалы (1 – <i>x</i>)CaF ₂ – <i>x</i> BaF ₂	Способ получения	Температура <i>ΔT</i> , К	Множитель А, См К/см	Энергия <i>E</i> _a , эВ
0.4CaF ₂ -0.6BaF ₂	НК	657-816	4.20×10^{4}	0.75
$0.5 CaF_2 - 0.5 BaF_2$	НК	640-831	1.06×10^{5}	0.77
	СК	564-789	1.44×10^{5}	0.84
$0.6 \text{CaF}_2 - 0.4 \text{BaF}_2$	НК	636-738	6.63×10^{4}	0.78
		738-824	9.17×10^{6}	1.09
$0.7 CaF_2 - 0.3 BaF_2$ [22]	СК	349-833	4.4×10^{4}	0.62

Таблица 2. Параметры уравнения Аррениуса–Френкеля для композиционных материалов в системе CaF₂–BaF₂

Примечание. НК – направленная кристаллизация, СК – спонтанная кристаллизация.

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 68 № 2 2023



Рис. 3. Процентное содержание фаз $Ca_{0.985}Ba_{0.015}F_2$ и $Ca_{0.05}Ba_{0.95}F_2$ в композитах в зависимости от состава по данным метода RIR (а). Изменение параметров решетки флюоритовых фаз в системе CaF_2 – BaF_2 ; черные кружки – данные [20] для неравновесных механосинтезированных твердых растворов $Ca_{1-x}Ba_xF_2$ (б).



Рис. 4. СЭМ-изображения поверхности композитов $(1 - x)CaF_2 - xBaF_2$ в поперечном сечении. Светлая фаза – твердый раствор на основе BaF₂.

ал 0.5CaF₂-0.5BaF₂, синтезированный методом спонтанной кристаллизации, показывает более высокую энергию активации электропереноса (0.84 эВ) и более низкую ионную проводимость (1.3×10^{-3} См/см при 823 К). По-видимому, это связано с разным размером зерен в керамических образцах.

Из сравнения композиционных материалов $(1 - x)CaF_2 - xBaF_2$ ($0.4 \le x \le 0.6$) с компонентами CaF_2 и BaF_2 (табл. 1) можно видеть, что электропроводность исследуемых композитов значительно выше исходных компонентов и находится на уровне ионной проводимости флюоритовых твердых электролитов $M_{0.9}R_{0.1}F_{2.1}$ (M = Ca, Sr, Ba; R = La-Lu, Y) [28–31]. Повышение проводимости композиционных материалов (1 - x)CaF₂-x BaF₂ обусловлено образованием ион-проводящих

межфазных границ с высокими электрофизическими характеристиками [22].

Сравнение композитов $(1 - x)CaF_2 - xBaF_2$ с метастабильным флюоритовым твердым раствором $Ca_{0.5}Ba_{0.5}F_2$, полученным методом MC [27], показывает, что ионная проводимость твердого раствора выше композитов примерно на один порядок. Однако механостимулированные составы непрерывного твердого раствора $Ca_{1-x}Ba_xF_2$ являются термически неустойчивыми и при нагревании распадаются [21].

Твердость и показатель преломления. Полученные значения H_V композитов существенно превышают микротвердость кристаллов CaF₂ [32] и BaF₂ (рис. 7). Наблюдаемое упрочнение полученных композиционных материалов связано с их многофазностью и большим количеством межзеренных границ. Микротвердость возрастает с уве-



Рис. 5. Спектры пропускания кристаллических компонентов и композитов $(1 - x)CaF_2 - xBaF_2$ в коротковолновом (а) и длинноволновом (б) диапазонах. На вкладках показаны прозрачность композита состава $0.4CaF_2 - 0.6BaF_2$ при искусственном освещении и концентрационная зависимость положения границы пропускания (по уровню T = 50%) для изученных образцов.

личением содержания CaF₂ и достигает значения $H_V = 2.0 \pm 0.1$ ГПа для состава x = 0.4. Возможно, состав (1 - x)CaF₂-xBaF₂ с максимальной твердостью лежит в диапазоне концентраций $0 \le x \le 0.4$. В [33] была исследована твердость композитов, содержащих от 50 до 100 мас. % BaF₂ и полу-



Рис. 6. Температурные зависимости ионной проводимости композиционных материалов в системе CaF_2-BaF_2 , полученных из расплава направленной $(1 - 0.4CaF_2-0.6BaF_2, 2 - 0.5CaF_2-0.5BaF_2, 3 - 0.6CaF_2-0.4BaF_2)$ и спонтанной кристаллизацией $(4 - 0.7CaF_2-0.3BaF_2$ [22], $5 - 0.5CaF_2-0.5BaF_2$, а также метастабильного флюоритового твердого раствора, полученного методом MC $(6 - Ca_{0.5}Ba_{0.5}F_2$ [27]).

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 68 № 2 2023

ченных сплавлением на воздухе в Ni-тигле. Наблюдается аналогичная тенденция — твердость увеличивается с ростом содержания CaF₂, но абсолютные показатели твердости для всех образцов оказались существенно ниже, чем в настоящей работе.

Эффективный показатель преломления гетерогенных композитов $(1 - x)CaF_2 - xBaF_2$ ожидаемо монотонно увеличивается с увеличением доли более высокопреломляющего фторида бария в составе (рис. 7).



Рис. 7. Концентрационные зависимости показателя преломления n_D и микротвердости H_V образцов в системе CaF₂–BaF₂.

выводы

В системе CaF₂–BaF₂ методом вертикальной направленной кристаллизации синтезированы композиционные материалы (1 - x)CaF₂–xBaF₂ ($x = 0.4, 0.5 \le 0.6$) с высокой ионной проводимостью $\sigma_{dc} = (1-3) \times 10^{-3}$ См/см при 823 К. Изученные гетерогенные композиты являются новым классом твердых ИК-прозрачных материалов. Их исследование представляет несомненный интерес для поиска и создания фторпроводящих твердых электролитов.

Авторы выражают благодарность А.Г. Савельеву, Б.В. Набатову и Н.А. Архаровой за помощь в получении экспериментальных данных.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Karkera G., Anji Reddy M., Fichtner M. // J. Power Sources. 2021. V. 481. P. 228877. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228877
- 2. Сорокин Н.И., Соболев Б.П. // Кристаллография. 2007. Т. 52. № 5. С. 870.
- 3. *Fergus J.W.* // Sens. Actuators. B. 1997. V. 42. № 2. P. 119.
 - https://doi.org/10.1016/S0925-4005(97)00193-7
- Klimm D., Rabe M., Bertram R. et al. // J. Cryst. Growth. 2008. V. 310. № 1. P. 152. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2007.09.031
- Kozak A., Samuel M., Chretien A. // Rev. Chim. Miner. 1971. V. 8. № 6. P. 805.
- *Nafziger R.H.* // J. Am. Ceram. Soc. 1971. V. 54. № 9. P. 467. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1971.tb12388.x
- 7. Бучинская И.И., Федоров П.П. // Успехи химии.
- 2004. T. 73. № 4. C. 404.
- O'Horo M.P., White W.B // J. Am. Ceram. Soc. 1971.
 V. 54. № 11. P. 588. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1971.tb12216.x
- 9. Федоров П.П., Бучинская И.И., Ивановская Н.А. и др. // Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 5. С. 652.
- Черневская Э.Г., Ананьева Г.В. // ФТТ. 1966. Т. 8. № 1. С. 216.
- Wrubel G.P., Hubbard B.E., Agladge N.I. et al. // Phys. Rev. Lett. 2006. V. 96. P. 235503. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.235503
- 12. Попов П.А., Круговых А.А., Зенцова А.А. и др. // Неорган. материалы. 2022. Т. 58. № 4. С. 414. https://doi.org/10.31857/S0002337X22040133
- Sata N., Eberman K., Eberl K., Maier J. // Nature. 2000. V. 408. P. 946. https://doi.org/10.1038/35050047

- Sata N., Jin-Philipp N.Y., Eberl K., Maier J. // Solid State Ionics. 2002. V. 154–155. P. 497. https://doi.org/10.1016/S0167-2738(02)00488-5
- Jin-Philipp N.Y., Sata N., Maier J. et al. // J. Chem. Phys. 2004. V. 120. № 5. P. 2375. https://doi.org/10.1063/1.1635809
- Guo X.X., Matei I., Jin-Phillipp N.Y. et al. // J. Appl. Phys. 2009. V. 105. P. 14321. https://doi.org/10.1063/1.3143623
- Merkle R., Maier J. // Z. Phys. Chem. 2022. B. 236. № 6-8. S. 991. https://doi.org/10.1515/zpch-2021-3173
- Ruprecht B., Wilkening M., Steuernagel S., Heitjans P. // J. Mater. Chem. 2008. V. 18. P. 5412. https://doi.org/10.1039/B811453F
- Duvel A., Ruprecht B., Heitjans P., Wilkening M. // J. Phys. Chem. C. 2011. 115. P. 23784. https://doi.org/10.1021/jp208472f
- Duvel A., Heitjans P., Fedorov P.P. et al. // J. Am. Chem. Soc. 2017. V. 139. P. 5842. https://doi.org/10.1021/jacs.7b00502
- Duvel A., Heitjans P., Fedorov P.P. et al. // Solid State Sci. 2018. V. 83. P. 188. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2018.05.011
- Сорокин Н.И., Бучинская И.И., Федоров П.П., Соболев Б.П. // Неорган. материалы. 2008. Т. 44. № 2. С. 234.
- 23. *Puin W., Rodewald R., Ramblau R. et al.* // Solid State Ionics. 2000. V. 131. № 1–2. P. 159. https://doi.org/10.1016/S0167-2738(00)00630-5
- 24. Scholz G., Meyer K., Düvel A. et al. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2013. B. 639. № 6. S. 960. https://doi.org/10.1002/zaac.201300083
- 25. *Ruprecht B., Wilkening M., Feldhoff A. et al.* // Phys. Chem. Chem. Phys. 2009. V. 11. № 17. P. 3071. https://doi.org/10.1039/B901293A
- Иванов-Шиц А.К., Сорокин Н.И., Федоров П.П., Соболев Б.П. // ФТТ. 1983. Т. 25. № 6. С. 1748.
- 27. Wilkening M., Duvel A., Preishuber-Pflugl F. et al. // Z. Kristallogr. Cryst. Mater. 2017. V. 232. № 1–3. P. 107. https://doi.org/10.1515/zkri-2016-1963
- Сорокин Н.И., Каримов Д.Н. // ФТТ. 2021. Т. 63. № 10. С. 1485. https://doi.org/10.21883/FTT.2021.10.51477.096
- Sorokin N.I., Breiter M.W. // Solid State Ionics. 1997.
 V. 99. P. 241.
 - https://doi.org/10.1016/S0167-2738(97)00190-2
- Sorokin N.I., Breiter M.W. // Solid State Ionics. 1999.
 V. 116. P. 157. https://doi.org/10.1016/S0167-2738(97)00190-2
- 31. *Fedorov P.P., Turkina T.M., Sobolev B.P. et al.* // Solid State Ionics 1982. V. 6. № 4. P. 331. https://doi.org/10.1016/0167-2738(82)90018-2
- 32. *Каримов Д.Н., Комарькова О.Н., Сорокин Н.И. и др. //* Кристаллография. 2010. Т. 55. № 3. С. 556.
- Deadmore D.L., Sliney H.E. // 1987. NASA Technical Memorandum 88979. https://ntrs.nasa.gov/citations/19870009237

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 68 № 2 2023